

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

61326-1

1997

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2
2000-08

Amendement 2

**Matériels électriques de mesure,
de commande et de laboratoire –
Prescriptions relatives à la CEM –**

**Partie 1:
Prescriptions générales**

Amendment 2

**Electrical equipment for measurement,
control and laboratory use –
EMC requirements –**

**Part 1:
General requirements**

© IEC 2000 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

D

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 65A: Aspects systèmes, du comité d'études 65 de la CEI: Mesure et commande dans les processus industriels.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
65A/307/FDIS	65A/312/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant 2001. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Ajouter, après l'annexe C, la nouvelle annexe normative D suivante:

Annexe D (normative)

Configurations d'essai, conditions de fonctionnement et critères d'aptitude à la fonction pour les matériels d'essai et de mesure sensibles destinés à des applications non protégées

D.1 Généralités

Outre les prescriptions de la présente norme, cette annexe spécifie des configurations d'essai plus détaillées, des conditions de fonctionnement et des critères d'aptitude à la fonction pour les matériels comportant des circuits d'essai et de mesure (à la fois internes et/ou externes aux matériels) qui ne sont pas protégés en ce qui concerne la CEM pour des raisons opérationnelles et/ou fonctionnelles, selon ce qui est spécifié par le constructeur.

Une liste non exhaustive de tels matériels comprend par exemple les oscilloscopes, les analyseurs logiques, les analyseurs de spectre, les analyseurs de réseau, les multimètres numériques et les systèmes de test de cartes à circuits imprimés.

Le constructeur spécifie l'environnement dans lequel le produit est destiné à être utilisé, et utilise les spécifications de niveau d'essai correspondantes de la présente norme.

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 65A: System aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement and control.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
65A/307/FDIS	65A/312/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until 2001. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

Add, after annex C, the following new normative annex D:

Annex D (normative)

Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications

D.1 General

In addition to the requirements of this standard, this annex specifies more detailed test configurations, operational conditions and performance criteria for equipment with test and measurement circuits (both internal and/or external to the equipment) that are not EMC protected for operational and/or functional reasons, as specified by the manufacturer.

Examples of such equipment include, but are not limited to, oscilloscopes, logic analyzers, spectrum analyzers, network analyzers, digital multimeters (DMM) and board test systems.

The manufacturer specifies the environment for which the product is intended to be used and utilizes the corresponding test level specifications in this standard.

D.2 Configurations d'essai

D.2.1 Accès E/S d'essai et de mesure

Les accès d'entrée d'essai et de mesure doivent être pourvus d'un capuchon et écourtés à moins que cela ne soit à l'origine de conditions de fonctionnement non compatibles avec la mesure de l'émission et de l'immunité du produit. On doit alors appliquer un signal d'entrée approprié.

Les accès de sortie d'essai et de mesure qui ne sont pas nécessaires à l'évaluation des fonctions essentielles de l'EST doivent être pourvus d'un capuchon et/ou éliminés.

NOTE 1 Il n'est pas nécessaire de connecter les sondes et/ou les cordons d'essai à utiliser avec les accès d'essai et de mesure. De tels cordons d'essai peuvent différer considérablement d'une application à l'autre et sont souvent connectés à des matériels dont le couvercle a été retiré et qui peuvent être plus ou moins démontés pour permettre l'accès à des points d'essai internes. Des cordons d'essai connectés peuvent accroître les émissions et/ou réduire l'immunité dans certaines applications.

NOTE 2 «Pourvu d'un capuchon» signifie protégé par un blindage local.

D.2.2 Matériel auxiliaire

Les matériels auxiliaires nécessaires au fonctionnement normal de l'EST doivent faire partie du matériel à tester.

D.3 Conditions de fonctionnement

Lorsque les deux options d'alimentation, par batteries et courant alternatif, sont possibles, les deux modes de fonctionnement doivent être conformes.

D.3.1 Oscilloscopes

Les accès de l'oscilloscope doivent être configurés pour obtenir la vitesse de balayage maximale, la sensibilité maximale et un mode d'acquisition continu lors des essais d'immunité, à moins que d'autres modes ne soient réputés créer des émissions plus importantes ou des résultats d'immunité plus mauvais en utilisation normale.

D.3.2 Analyseurs logiques

L'analyseur logique doit être configuré en mode d'analyse de données pendant les essais d'émission, et en mode d'acquisition de données pendant les essais d'immunité, à moins que d'autres modes ne soient réputés créer des émissions plus importantes ou des résultats d'immunité plus mauvais en utilisation normale.

D.3.3 Multimètres numériques

Les configurations habituelles comportent la détection de crête, la sensibilité maximale (si l'option de sélection de gamme automatique est disponible, elle suffira généralement) et le mode d'acquisition continu.

D.3.4 Autres matériels

Pour les matériels qui ne sont pas mentionnés en D.3.1 à D.3.3, on doit appliquer le concept suivant: une sélection des modes de fonctionnement représentatifs doit être faite en tenant compte du fait que seules les fonctions les plus caractéristiques du matériel peuvent être testées. On doit choisir les pires cas connus parmi les modes de fonctionnement en utilisation normale.